

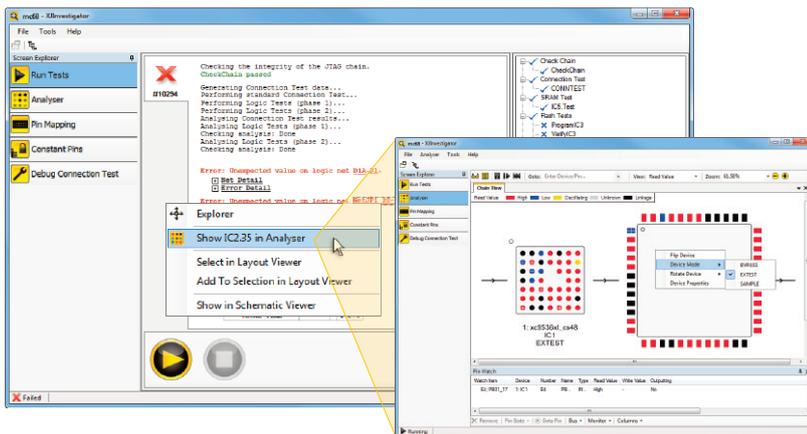
Übersicht

XJInvestigator ermöglicht es Ihnen, Probleme auf fehlerhaften Leiterplatten zu diagnostizieren. Durch die Kombination der Testfähigkeiten von XJRunner und XJAnalyser sowie zusätzlichen Diagnosefunktionen ist XJInvestigator das geeignete Boundary-Scan-Tool für Ihre Leiterplatten-Reparatur- und Überarbeitungsstation.

Einfache, leistungsstarke und flexible Diagnosetests

XJInvestigator extrahiert alle erforderlichen Informationen, um Ihre Leiterplatten aus der gleichen verschlüsselten XJPack-Datei zu testen und zu debuggen, die auch von XJRunner verwendet wird. Um Beständigkeit im Testprozess zu gewährleisten, können die vordefinierten Testfunktionen nicht abgeändert werden. XJInvestigator bietet jedoch die zusätzlichen Flexibilität- und Konfigurationsmöglichkeiten, die Sie bei der Fehlersuche benötigen.

Wenn ein Problem mit einer Leiterplatte identifiziert wurde, können Sie einzelne Tests, Testsets oder zusätzliche Funktionen auswählen, die nicht bereits in der Produktionsprüfung enthalten sind. Die Tests können auch regelmäßig durchgeführt werden und dabei behilflich sein, besonders schwierige oder sporadisch auftretende Probleme zu diagnostizieren.



Bessere Diagnosefunktionen

Wenn die Fertigungslinien-Tests aufgrund von Problemen mit der JTAG-Kette auf einer Leiterplatte nicht ausgeführt werden können, hilft Ihnen der eingebaute JTAG-Ketten-Debugger, diese Fehler schnell zu identifizieren, damit die normalen Tests fortgesetzt werden können.

Layout- & Schematic Viewer

Dank der Darstellung des physischen und logischen Aufbaus einer Leiterplatte können sowohl der Layout- als auch der Schematic Viewer* dazu verwendet werden, Fehler nachzuvollziehen und zu lokalisieren.

* Die Layout- und Schematic Viewer sind nur dann verfügbar, wenn Sie die dafür benötigten Informationen in die XJPack-Datei aufnehmen.

Direkte Steuerung der Geräte

Einfache Ad-hoc-Tests können sehr schnell durch die Steuerung und Überwachung von Signalen auf der Leiterplatte von Ihren JTAG-fähigen Geräten, sogar BGAs, implementiert werden. Auf dem Analysator-Bildschirm können Logikpegel auf Togglen, High oder Low eingestellt werden. Die Werte der von der Leiterplatte ausgelesenen Pins werden in einer einfachen, farbcodierten Anzeige dargestellt.

Wesentliche Vorteile

- Erhöhen Sie Ihre Produktionserträge – reparieren Sie Leiterplatten, die sonst als unbrauchbar entsorgt würden
- Reduzierung der Leiterplatten-Debug-Zeit – arbeiten Sie in einer einzigen integrierten Umgebung
- Behalten Sie die Kontrolle darüber, wie die Leiterplatten getestet werden
- Reduzieren Sie die Trainingskosten dank einer intuitiven, benutzerfreundlichen Bedienoberfläche

Features

- Reparatur-fokussierte Umgebung für XJDeveloper/XJRunner-Tests
- Vollständiger Verbindungstest
- Testen von RAM, Flash und anderen Nicht-JTAG-Komponenten
- Flash, FPGA, CPLD und EEPROM-Programmierung
- Layout Viewer* um den physischen Standort fehlerhafter Netze, Pins und Komponenten anzuzeigen
- Schematic Viewer* um das Schaltungsdesign im Bereich des Fehlers anzuzeigen
- Direkte Steuerung der Pins/Balls von JTAG-Komponenten
- Verfolgen Sie Signale zur Identifizierung von Kurzschlüssen, offenen Stromkreisen und anderen Fehlern

Pin-Betrachtung (Pin-Watch)

Pins können in einem Betrachtungsfenster beobachtet werden, welches auf einfache Weise erlaubt, das Verhältnis zwischen ihnen zu bestimmen. Dies ist sogar dann möglich, wenn sie sich auf unterschiedlichen JTAG-Komponenten befinden.

Sie können zudem Pins in Busse gruppieren, den Bussen Werte zuweisen und diese betrachten, um somit noch effizienter testen zu können.

Flexible Schnittstelle

Indem die Testergebnisse sichtbar sind, während Sie Analyser und die anderen Debugging-Funktionen wie den Layout- und Schematic Viewer verwenden, hilft die XJInvestigator-Benutzeroberfläche, den Debugging-Prozess weiter zu optimieren und zu vereinfachen.